

1. Record Nr.	UNISA996215705003316
Titolo	2012 19th IEEE International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : IEEE, 2012
ISBN	1-4673-0983-4
Descrizione fisica	1 online resource (408 pages)
Disciplina	621.3815
Soggetti	Integrated circuits - Defects Integrated circuits - Design and construction
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph